

Dienstag, 8. Oktober 2013

8:00 - 9:00	Registrierung
--------------------	----------------------

9:00 - 9:15	Eröffnung und Begrüßung
--------------------	--------------------------------

	Prof. Dr. G. H. Michler, Präsident Bethge-Stiftung für Angewandte Elektronenmikroskopie, Halle (Saale) Grußwort der Institutsleitung des Fraunhofer IWM Halle
--	--

9:15 - 10:15	Ultramikrotomie in der Materialforschung I
---------------------	---

09:15 - 09:45	<i>Ultramikrotomie in der Materialforschung: Erfolge und Herausforderungen</i> Sven Henning, Fraunhofer IWM Halle
---------------	--

09:45 - 10:15	<i>Vorpräparations- und Präparationstechniken für die elektronenmikroskopische Untersuchung</i> Robert Ranner, Leica Mikrosysteme GmbH
---------------	---

Pause

11:00 - 12:30	Ultramikrotomie in der Materialforschung II
----------------------	--

11:00 - 11:30	<i>Hard Materials: A Method of Specimen Preparation</i> Gareth Jenkin Morgan, Brooks University, Oxford and consultant RMC Boeckeler Instruments
---------------	---

11:30 - 12:00	<i>In situ-Mikrotomie (3View 2XP)</i> Roland Ries, Michael Felsmann, Gatan GmbH
---------------	--

12:00 - 12:30	<i>Review of 3View: Practical Experiences with in situ Ultramicrotomy in the ESEM</i> Armin Zankel, FELMI Graz
---------------	---

Pause: Imbiss und Geräteausstellung

14:00 - 16:00	Anwendungen der Ultramikrotomie und von Ionenstrahlverfahren I
----------------------	---

14:00 - 14:30	<i>Anwendung der Ultramikrotomie für TEM- und AFM-Untersuchungen an Polymermaterialien</i> Reinhold Godehardt, MLU Halle-Wittenberg
---------------	--

14:30 - 15:00	<i>Cryo-Ultramikrotomie an Polymerwerkstoffen</i> Bob Vastenhout, DOW Benelux, Terneuzen und Georg Bar, DOW Germany, Schkopau
---------------	--

15:00 - 15:30	<i>Schneiden mit Diamantmesser</i> Gareth Jenkin Morgan, Brooks University, Oxford
---------------	---

15:30 - 16:00	<i>Progress Towards Cryo FIB Lift-Out</i> Sven Curtze, Oxford Instruments
---------------	--

Pause

16:00 - 18:00	Führung durch das Fraunhofer Center für Angewandte Mikrostrukturdiagnostik CAM
----------------------	---

	- Führung durch das CAM - Gerätevorführung GATAN Ilion II
--	--